PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-159528

(43)Date of publication of application: 19.06.1990

(51)Int.CI.

G01J 3/12

(21)Application number: 63-313163

(71)Applicant: ANDO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing:

12.12.1988

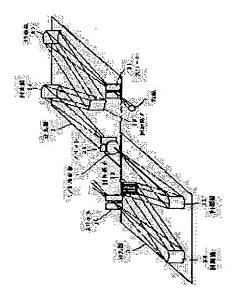
(72)Inventor: IWASAKI TAKASHI

(54) TWO-STAGE TYPE SPECTROSCOPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable prevention of a change in efficiency depending on condition of polarization of incident light with a correction of polarization characteristic by replacing a component P of an output of a first spectroscope with a component S thereof to be inputted into a second spectroscope.

CONSTITUTION: A first spectroscope 2 is arranged on a plane and when light of a light source 1 is analyzed to be applied to a 1/2 wavelength plate 4, the 1/2 wavelength plate 4 turns the direction of a component x and component y of a polarization component of an output of the spectroscope 2 by 90° so that the components x and y are given a phase difference of 180° to be inputted into a second spectroscope 3. Here, as the spectroscopes 3 and 2 have a diffraction grating 33 equal in polarization characteristic, the polarization characteristic is corrected. Thus, angles of diffraction gratings 23 and 24 are so set that wavelengths passing through slits 25 and 35 are equal to pick up light only with a specified wavelength at a slit 35 out of light of the light source 1 thereby enabling the keeping of a permeability regardless of the current state of polarization.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-159528

®Int. Cl. ⁵

識別記号

安藤電気株式会社

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)6月19日

G 01 J 3/12

8707-2G

審査請求 未請求 請求項の数 3

会発明の名称 二段式分光器

勿出 願 人

顧 昭63-313163 20特

②出 願 昭63(1988)12月12日

隆 志 @発 明 者

東京都大田区蒲田 4 丁目19番 7 号 安藤電気株式会社内

東京都大田区蒲田 4 丁目19番7号

四代 理 人 弁理士 小俣 欽司

> FP02-0204-<u>00W0-SE</u>

SEARCH REPORT

- 二段式分光器 1. 発明の名称
- 2. 特許顕求の範囲
 - 1. 水平面に配置され、光原(1)の光を分光す る第1の分光器(2)と、

第1の分光器(2) 出力に接続される2分の 1 放長板(4)と、

第1の分光器(2)と偏波特性が等しく、前 紀水平面に配置され、2分の1波長板(4)の 出力を分光する第2の分光器(3)とを備える ことを特徴とする二段式分光器。

2. 水平面に配置され、光源(1) の光を分光す る第1の分光器(2)と、

第1の分光器(2) 出力に接続され、80° ね じられる個放面保存光ファイバと、

第 1 の分光器(2) と偶波特性が等しく、前 紀水平面に配置され、偏波面保存光ファイバ の出力を分光する第2の分光器(3)とを備え ることを特徴とする二段式分光器。

3. 水平面に配置され、光源(i) の光を分光す

る第1の分光器(2)と、

第1の分光器(2)と偽放特性が等しく、前 記水平面と垂直な垂直面に配置され、第1の 分光器(2) の出力を分光する第2の分光器(3) とを備えることを特徴とする二段式分光器。

- 3. 発明の詳細な説明
 - (a) 発明の技術分野

この発明は、光源の光を第1の分光器で分光し、 第1の分光器と個波特性が等しい第2の分光器で 第1の分光器出力を分光する二段式分光器につい てのものである。

(b) 従来技術と問題点

次に、従来技術の構成を第3回を参照して説明 する.

第3図の1は光源、2と3は分光器である。

分光器 2 は、スリット 2 1 、四面線 2 2 、回折 格子23、凹面貌24及びスリット25から構成 されている。

分光器3は分光器2と個放特性が等しいもので あり、郊3図は、光瀬1の光を縦続接続された分 光器 2 と分光器 3 で分光している状態を示したものである。

5 m

次に、第3図の光スペクトラムを第8図により 説明する。

第8図の11は光顔1の光スペクトラム、12は分光器2の光スペクトラム、13は分光器3の 光スペクトラムである。すなわち、光顔1の光スペクトラム11は分光器2で帯域の狭い光スペクトラム12になり、分光器3でさらに帯域の狭い

回折格子23・33の角度を変えれば、凹面鎖24・34へ回折する光の波長が順次変化し、特定の波長だけをスリット25・35から取り出すことができる。

そこで、スリット25を通過する波長とスリット35を通過する波長が等しくなるように、回折格子23・33の角度を設定すれば、光源1の中から、特定の波長の光だけを取り出すことができる。

例えば、白色光から波長が 600mmの成分だけを

に傾斜した楕円状態になっている。

分光器の出力としては、第4図と相似形の第6図のような個波状態の分光出力が望ましい。

例えば、光源1の光を分光器2のスリット21 に入れ、分光器3のスリット25から出た光をセンサで受光し、回折格子23・33の角度を同時に変えて、光源1のスペクトラムを測定する場合、光源1の偏波状態が変動すると、スペクトル測定波形が変動してしまう。

また、半導体レーザ等で複数の傷波状態の光の 混じった光源を測定する際、測定波形に誤差が出 てしまう。

特に、光源1の光は回折格子23・33を2回 通過しており、回折格子23に重直入射した光は 回折格子33にも垂直に入射する。

また、回折格子23に平行入射した光は回折格子33にも平行に入射する。

このため、通常の分光器と比べて、二段式分光器は個波による影響をより大きく受けることになる。

取り出すことができる。

第3回のような構成を二段式分光器といい、光源 1の光が同折格子を1回しか通過しない通常の分 光器と比べて、より純度の高い単色光が得られる という特徴をもつている。

例えば、 600mmの波及の光を取り出す場合、 601mm以上の波及成分の 600mmに対する減衰量は、 通常の分光器では35dB程度であるが、二段式分光 器では約70dBの減量度が得られる。

しかし、回折格子は光源1の偏光成分のうち、 回折格子の再に平行に入射するP成分と、垂直に 入射するS成分とで回折効率が異なるという性質 を持つている。

したがって、光源 1 の 偏光状態によって、分光 器の損失が違ってくるという問題がある。

この関係を羽4図と羽5図で説明する。

第4回は光源1の偏波状態図であり、第5回は 分光器2の出力の偏波状態図である。

第4図では、×成分と9成分が45°の楕円状になっているが、第5図では第4図に比べて×方向

(c) 発明の目的

この免明は、郊1の分光器と、郊1の分光器と
観波特性がみしい回折格子を備えた郊2の分光器を第1の分光器に接続し、郊1の分光器の出力の
P 成分とS成分を入れ変えてから、郊2の分光器に入れることにより、第1の分光器と郊2の分光器の個光特性を補正した二段式分光器の提供を目的とする。

(d) 発明の実施例

次に、この発明による実施例の構成図を第1図に示す。

第1図の4は2分の1波及板であり、その他は 第3図と同じである。

すなわち、 第1図は第3図に2分の1被長板4 を追加したものである。

2分の1波長板4は、分光器2の出力の偏波成分の×成分とy成分を80°向きを変える役目をす

この関係を、第5図と第7図で説明する。

分光器2の出力が第5回とすれば、2分の1波

長板4の山力は第7回になる。 すなわち、第7図 は第5図に対しx成分としy成分が90°回転した

1 1,

第7図の偏波特性をもった光を分光器3に入れ れば、xyの特性が補正されて、軍8回に示すよ うな偏波特性をもった出力光が得られる。

また、2分の1波長板4の代わりに偏波面保存 ファイバ労を用いることもできる。

その既は、スリット15の出射光を偏放面保存 ファイバにファイバのもつ基準方向と e x または eyが一致するように入射し、ファイバを90° ねじたった後に、凹面鎖17に出射させることで、 ex およびey に90°の回転を与える。

このとき、exとexの位相差φが変化しても $\int_{0}^{\infty} \cos(\omega t + \phi) d t d - 定なので平均パ$ $y i = E \sin\theta (-\cos(\omega t + \phi))$ ヮーには影響しない。

次に、第1図の特性を説明する。

2分の1波長収4は、波長板のもつ光学軸方向 が光のEx 成分に対し45°の角となるように配置 する.

かる。

人射光を次式で表す。

 $ex = E \cos\theta \cos\omega t$

 $e y = E \sin \theta \cos (\omega t + \phi)$

すると、入射光の平均パワーPは、

 $P = \epsilon / 2 \cdot E^2 + \pi \delta.$

次に、スリット25の出射光は回折格子23に より回折された後であるから、

ex 1, er 1 & 8 < &,

$$e \times 1 = \sqrt{K3} e \times$$

$$e y 1 = \sqrt{Kp} e y$$

次に2分の1波長板4を透過すると、 e x 1、 . e y l とも光学軸となす角のは45°なので、それ ぞれ 2 heta になる。つまり 30° 光学触方向に回転す

すなわち、 e x l は y 軸方向の成分であり、 ey 1は×軸方向の成分となる。

したがって、2分の1波及板4の透過光ex 0

e x 2 = e y 1

2分の1波長板4は、光学軸方向に平行に入射 する光 (x 成分とする)と、垂直に入射する光 (y 成分) との間に 180° の位相差を与える。

いま、入射光を次式で表すと、

 $x = E \cos \theta \cdot \cos \omega t$

 $y = E \sin \theta \cdot \cos (\omega t + \phi)$

ただし、θは結晶軸と偏波面となす角である。

出射光は7成分が 180° 進むとして、

 $x = E \cos \theta \cdot \cos \omega t$

 $y t = E \sin \theta \cdot \cos(\omega t + \phi + 180)$ となる。

x 1 = E cos (- θ) cosω t

 $\because \cos \theta = \cos (-\theta)$

 $= E (- sin \theta) cos (\omega t + \phi)$

= E sin $(-\theta)$ cos $(\omega t + \phi)$

となり、人引光の偏波面は0であるのに対し、 出射光のそれは-θであるから、出射光の偏波面 は光学軸を中心として20だけ回転することがわ

e y = e x 1

さらに、回折格子33を経由してスリット35 から出射する光ex3、ey3は、

$$e x_3 = \sqrt{K s} e x$$

$$e y_3 = \sqrt{K p} e y$$

以上から、

$$e y_7 = \sqrt{K s} \sqrt{K p} K P e x$$

したがって、出射光の平均パワーPのは

 $Po = e/2 \times \omega/2 \pi \int_{a}^{c} (ex^{2}, +ey^{2},) dt$ = E/Z×W/ZT (4K, VK, ey)+(VK, 4K, ex)dt

= $\varepsilon/z \cdot w/z\pi \times k_P k_S \int_0^{2\pi} (e z^2 + e y^2) dt$ = $k_P k_S \varepsilon/z \cdot \varepsilon^2 + \epsilon y^2$

となり、日やゆに関係なく一定であ。

すなわち、個放状態に関係なく透過率が一定で ***** * * -

なお、凹面就 1 2 ・ 1 4 ・ 1 8 ・ 1 8 に 損失が あっても構わない。

また、2分の1波長板4が光の平行底の影響を うける場合は、2分の1波長板4を凹面鏡32と 回折格子33の間に配置するか、あるいは2分の 1波長板4の前後に適当なレンズや鏡等を配置し て2分の1波長板4への入射光が平行になるよう にすればよい。

, a .

また、 2 分の 1 波長板 4 の代わりに 偏波面保存ファイバ等を用いることもできる。

その既は、スリット25の出射光を偏波面保存ファイバのファイバがもつ抵準方向とex またはey が一致するように入射し、ファイバを80° ねじった後に、凹面線32に出射させることで、ex およびey に30°の回転を与える。

このとき、exとexの位相差が変化しても oos(ωt+φ) dtは一定なので平均パワー には影響しない。

そこで、スリット25を適遇する放長とスリット35を適遇する放長が等しくなるように回折格子23と回折格子33の角度を設定することで、 光源1の光の中から特定の放長の光だけをスリッ

 $P = \epsilon / 2 \times \omega / 2 \pi \int_{\epsilon}^{2R} (e x^{2} + e y^{2}) d t$ $= \epsilon / 2 \times \omega / 2 \pi$ $\times \left[\int_{\epsilon}^{2R} (E \cos \theta \cos \omega t)^{2} d t + \int_{\epsilon}^{2R} (E \sin \theta \cos (\omega t + \phi))^{2} d t \right]$ $= \epsilon / 2 \times \omega / 2 \pi (2 \pi / \omega \times E^{2} \cos^{2}\theta)$ $= \epsilon / 2 \times E^{2}$

となる。

ただし、とは誘電率とする。

一方、スリット35の出射光の各電界成分をex1、ey1とすると、ex1はexが回折格子23に源方向に垂直に入射したのち、回折格子33の源方向に平行に入射したものの回折光であり、ey1はeyが回折格子23の源方向に垂直に入射したものの回折光であるから、

$$e x 1 = \sqrt{Kp} \sqrt{Ks} e x$$

$$e y 1 = \sqrt{Kp} \sqrt{Ks} e y$$

となる。

したがって、出射光の平均パワーPoは、

ト35から取り出すことができる。

次に、この免明による他の実施例の構成図を第 2 図に示す。

第2回は、第3回の分光器3を分光器2に対して30°向きを変えて配配したものであり、第1回の2分の1波長板4の役目を分光器3の取付面を変えることにより実現したものである。

次に、第2図の特性を説明する。

回折格子23と回折格子33の回折効率をKゥ、 Ksとする。

ただし、Kp は溝に平行な成分に対する効率とし、Ks は溝に垂直な成分に対する効率とする。

入射光のEx、Eyの電界成分をそれぞれex、 eyとすると、

 $ex = E \cos \theta \cos \omega t$

 $ey = E \sin\theta \cos(\omega t + \phi) \ge t \delta$.

ただし、Εは世界の設幅、 0 は世界の設動面 (偏波面)のX軸となす角、ωは光の角周波数、 tは時間、φは e x と e y の位相差とする。

したがって、入射光の平均パワーPは、

Po =
$$\varepsilon$$
 / 2 × ω / 2 π $\int_{0}^{2\pi} (e x^{t}1 + e y^{t}1) d t$
= ε / 2 × ω / 2 π
× $\int_{0}^{2\pi} [(\sqrt{K p}/K s e x)^{2}]$
+ $(\sqrt{K p}/K s e y)^{2} d t$
= ε / 2 × ω / 2 π
× $\int_{0}^{2\pi} K p K s (e x^{2} + e y^{2}) d t$
= $K p K s \varepsilon$ / 2 × E^{2}

೬೮೩.

ここで、PとPoとの比は、

 $P \circ / P = K_P K_S \epsilon / 2 \times E^2 / \epsilon / 2 \times E^3$ = $K_P K_S$

となり、0やめに関係なく一定である。

すなわち、偏波状態に関係なく通過率が一定である。

(e) 発明の効果

この発明によれば、次のような効果がある。

(7) 入射光の個放状態によって効率の変化しない分光器を提供できる。

例えば、偏放状態による透過率が約 4dBあるとき、1dB以下に減らすことができる。

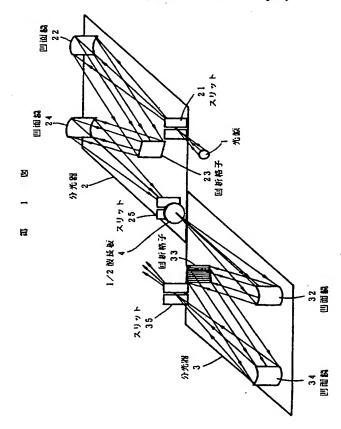
(1) この発明による二段式分光器で光線のスペクトラムを測定した場合、 偏故の影響がないので、正確な測定ができる。

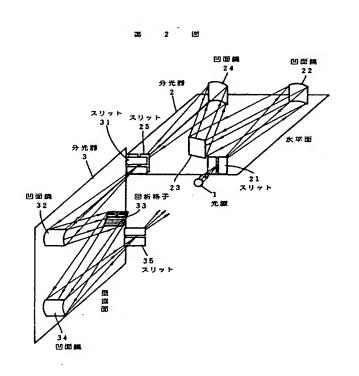
4. 図面の簡単な説明

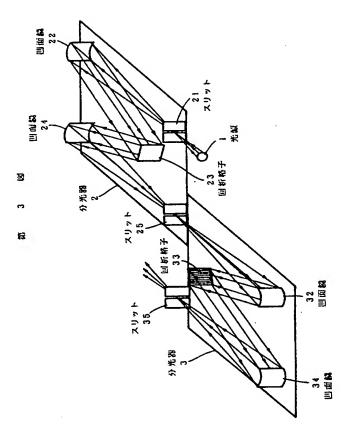
第1図はこの発明による実施例の構成図、第2図はこの発明による他実施例の構成図、第3図は従来技術の構成図、第4図は光源1の偏波状態設明図、第5図~第7図は分光器出力の偏波状態設明図、 38図は第3図の光スペクトラムである。

1 ······ 光源、 2 · 3 ····· 分光器、 4 ····· 2 分の 1 波及板、 2 1 ······ スリット、 2 2 ····· 凹面線、 2 3 ····· 回折格子、 2 4 ······ 凹面線、 2 5 ····· スリット、 3 1 ····· スリット、 3 2 ····· 凹面線、 3 3 ····· 回折格子、 3 4 ····· 凹面線、 3 5 ····· スリット。

代理人 弁理士 小 俣 欽 司







特開平2-159528 (6)

